



Bundesanstalt für
Materialforschung
und -prüfung

CR-Speicherfolien-System
Zertifikat-Nr.: BAM/ZBF/002/14
1. Neufassung

Hiermit wird von der BAM-Zertifizierungsstelle bescheinigt, dass das

industrielle CR-Speicherfolien-System

mit der Bezeichnung

HD-CR 35 NDT Plus

bei Verwendung von Speicherfolien HD-IP Plus

des Herstellers

Dürr NDT GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland

die Anforderungen der höchsten Systemklasse IP 1 / 40 nach EN 14784-1:2005 sowie ISO 16371-1:2011 für industrielle Computer-Radiographie mit Speicherfolien in der Zerstörungsfreien Prüfung erfüllt, wenn die Belichtungsdosis von 9 mGy nicht unterschritten wird. Diese Dosis entspricht einer CEN-Empfindlichkeit und ISO-Speed von 100 bei einer Pixelgröße von 15,5 µm. Die erreichbare maximale Basisortsauflösung beträgt 40 µm. Andere Systemklassen (CEN/ISO: IP 2 / 40 bis IP 6 / 40) ergeben sich bei geringeren Belichtungsdosiswerten (siehe Prüfbericht Nr. 8.3/7648a vom 2014-05-06). Das Netz-Diagramm mit der Zusammenfassung der CR-System-Charakterisierung nach ASTM E 2446-16 befindet sich auf der Rückseite dieses Zertifikats. Das Verfahren Nr. BZS-GS/085/17 bildet die Basis für diese 1. Neufassung.

Die Zertifizierung erfolgt auf der Grundlage des Vertrages **Nr. BAM-ZBA-0001-2006-Dürr** entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17065:2013 und beinhaltet eine Baumusterprüfung (BAM-Zertifizierungssystem I).

Die von der BAM zertifizierten Produkte dürfen mit den BAM-Zertifizierungszeichen „BAM Baumustergeprüft“ bzw. „BAM Design-type tested“ in Verbindung mit der Zertifikats-Nr. gekennzeichnet werden.

Das Zertifikat ist gültig bis zum **4. Mai 2022**.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87,12205 Berlin, **2018-05-05**

Im Auftrag

Dr. R. Schmidt
BAM-Zertifizierungsstelle



Im Auftrag

Dr. U. Zscherpel
Bewerter

Ausfertigungsverteiler: 1. Zertifikatsinhaber 2. BAM-Zertifizierungsstelle

Die BAM-Zertifizierungsstelle ist eine durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde (D-ZE-11075-21-00) aufgeführten Zertifizierungsbereiche.

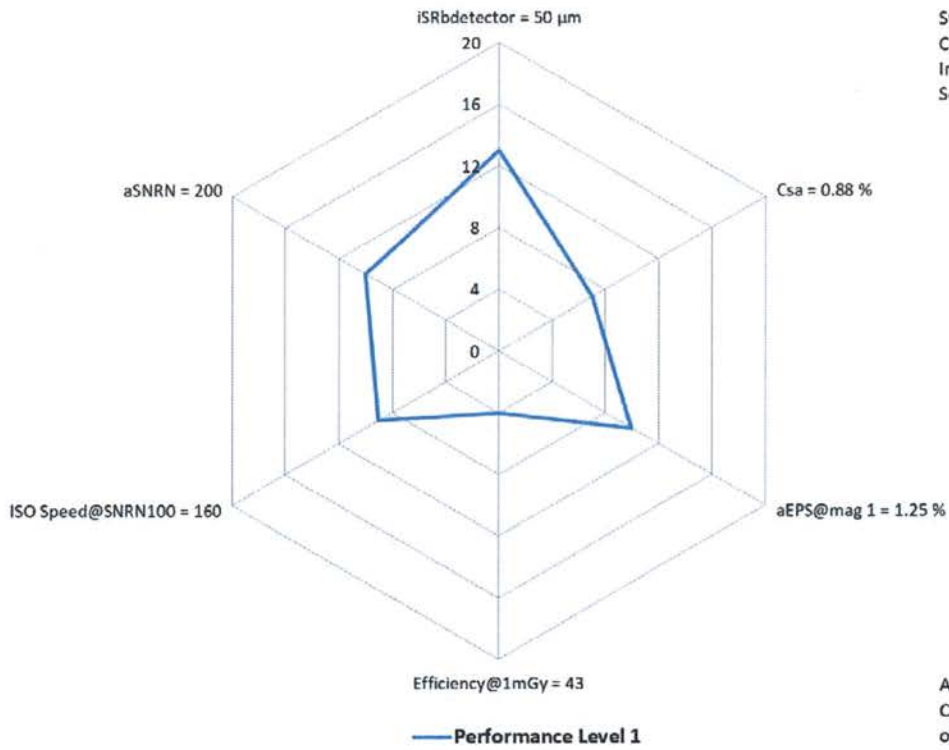
Dieses Zertifikat darf nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und für Auszüge ist vorher die widerrufliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Rechtsverbindlich ist die deutschsprachige Fassung. Gerichtsstand ist Berlin.

ZERTIFIKAT

Qualification of Duerr HD-CR 35 NDT Plus with HD-IP Plus imaging plates according to ASTM E 2446-16:



System parameters:
CR scanner Duerr HD-CR 35 NDT Plus
Imaging plates HD-IP Plus
Scan resolution 15,5 μm



Annex to
Certificate BAM/ZBF/002/14
of 2018-05-05